

粒度分布と内部組織を複合分析 短時間・高効率の新手法

阪大、理研など

大阪大学、慶應大学、
理化学研究所、信州大学
は共同で、X線自由電子
レーザー施設SACLAC
で金属ナノ粒子の粒度分
布と内部組織を複合的に
解析する方法を開発し
た。短時間で高効率に粒
度分布を導出するだけで
なく、粒子の電子密度分
布を10nm以下の分解能
で可視化し、粒子径と内
部組織の関係も明らかに
することができる。同グ
ループは触媒など産業利
用もできるように、さら
なる測定時間の短縮など
を進めていく。

同グループが用いたの
度分布を導出するだけで
なく、粒子の電子密度分
布を10nm以下の分解能
で可視化し、粒子径と内
部組織の関係も明らかに
することができる。同グ
ループは触媒など産業利
用もできるように、さら
なる測定時間の短縮など
を進めていく。

は、X線の干涉性を利
用したコヒーレントX線
回折イメージング(CX
DI)。従来のX線では1
枚の回折パターン取得に
10分以上が必要だった
が、SACLACで得られ
る極めて高い輝度の高
いコヒーレントX線を駆
使することで、粒度分布
と内部組織の複合分析を

実行することで電子密度
も再構成できる。分解能
は約7nmと世界最高の
分解能だった。

ナノ粒子は比表面積が
大きいため、量子サイズ
効果など固体(バルク)
の材料と異なる特有の物
性を示すことが知られ
る。とくにナノ粒子の光
学的特定は、粒子のサイ
ズ、形状、表面/内部組

織のようなら多くの構造が
ラメータで決定され
る。しかし、形状を制御
しながら合成するのは難
しく、粒子の統計的な構
造情報を把握することが
必要となっている。

粒子のサイズ分布など
は、一般的に動的光散乱
法やレーザー回折法のよ
うな可視光や電子顕微鏡
観察による画像解析が用
いられるが、可視光では
高度な解析が難しく、電
子顕微鏡では金属内部の
構造情報を得ることが難
しいという問題があつた。

同グループでは触媒設
計など産業利用に貢献で
きるとしており、測定時
間を現在の3時間からさ
らに短縮する照射装置な
ど開発を進めている。